X-Strata960

Système de mesure par fluorescence X pour le contrôle des épaisseurs de revêtements

The Business of Science™

OXFORD INSTRUMENTS

Une longueur d'ava
la mesure d'épais

35 années d'expérience en XRF

Fort de son expérience, Oxford Instruments élargit sa gamme d'équipements dédiés à la mesure d'épaisseur des revêtements

- **35** ans de savoir-faire dans le domaine de la fluorescence X
- **25** ans d'expérience dans le développement des instruments de mesure d'épaisseur des revêtements
- **15** ans d'expérience dans la mesure d'épaisseur des revêtements par fluorescence X

1968 – Lancement du premier analyseur portable de minerais (PMA) permettant des analyses fiables sur site

1980 – Lancement de la gamme d'instruments de mesure **CMI** utilisant les techniques de micro-résistance, induction magnétique, courants de Foucault et rétrodiffusion de rayons beta

1990 – Lancement de la série **CMI**900 utilisant la fluorescence X pour la mesure d'épaisseur des revêtements

2001-2003 Oxford Instruments investit fortement dans le développement et la conception d'un nouveau système de mesure d'épaisseur des revêtements par XRF

2004 – Une nouvelle génération de systèmes XRF est née, **X-Strata**960

X-Strata960, **la gagnante**

- **Qualité améliorée –** Garantit le respect des spécifications clients
- **Coûts réduits –** Limite les erreurs de production et les coûts de retraitement associés

Consulter notre site pour plus d'informations:

nce dans
seur des revêtements

solution

- **Process maintenu –** Ajuste les réglages du process pour une efficience maximale
- **Rentabilité augmentée –** Améliore la marge sur chaque commande

X-Strata

L'**X-Strata**960, conçu sur les bases solides et éprouvées de la série **CMI**900 offre désormais:

- Une version améliorée et conviviale du logiciel **Smart**Link
- Plus de fonctionnalités
- Des opérations de maintenance plus espacées

Complètement redéfini pour inclure:

- Un tube à rayons X plus puissant
- Une surface d'analyse réduite
- Une mesure indépendante de la distance
- La focalisation automatique du laser
- Un positionnement échantillon améliorée
- PC et interface utilisateur intégrés

X-Strata offre tous les avantages indispensables pour une mesure fiable et précise

- Amélioration du positionnement
- Plus grande précision de la mesure
- Choix étendu d'applications

www.oxford-instruments.com

Mesures sur tout type d'échantillons

Nouvelle chambre pour échantillons volumineux

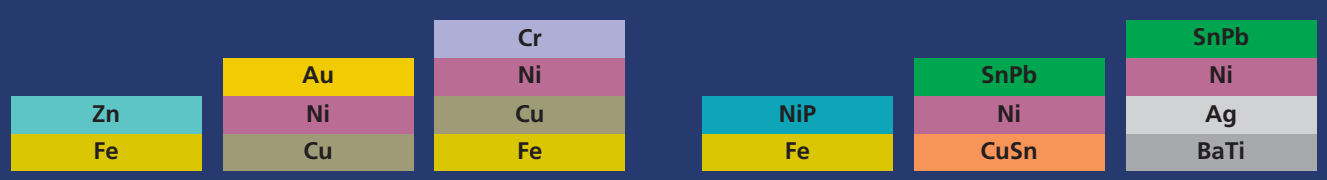
- Grandes dimensions – 580x510x230 mm
- Chambre spécifiquement développée pour le passage d'échantillons volumineux
- Mise en place aisée des échantillons

3 options de table

- Programmable XY (200x200 mm)
- Manuel XY (250x250 mm)
- Positionnement fixe

Et… Contrôle automatique du Z : 230 mm

Détermination des épaisseurs de revêtements multicouches et de la composition des matériaux



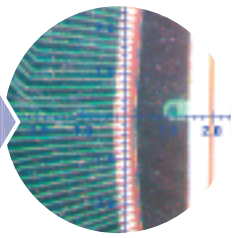
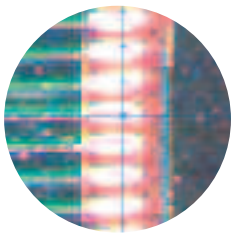
Tube à rayons X 100 watts

- Précision accrue de 30% pour un même temps de mesure
- Temps de mesure réduit de 50% pour une même précision

PLUS RAPIDE ... PLUS PRÉCIS

Tube à rayons X micro-focalisé

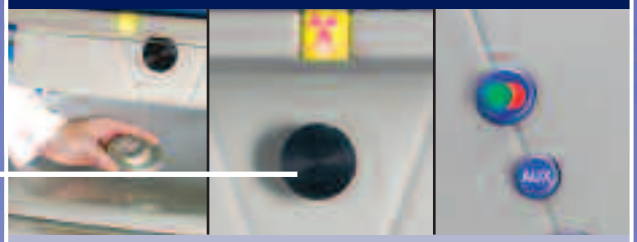
- Plus grande précision avec taux de comptage élevé
- Taille du faisceau très réduite
- Compteur proportionnel haute résolution
- Caméra couleur numérique équipée d'un zoom
- Haute précision de l'axe Y

X20	Collimateur 15µmx80
	

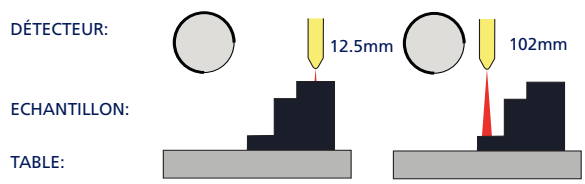
LE FUTUR EST DANS L'INFINIMENT PETIT

Mesure automatique de la distance

Grande simplicité



- Ajustement et correction automatique du système : un seul étalonnage, pas de nécessité de réglage de la distance focale
- Grande flexibilité sur des échantillons de forme irrégulière permettant une mesure sur différents niveaux dans une gamme comprise entre 12,5 et 102 mm

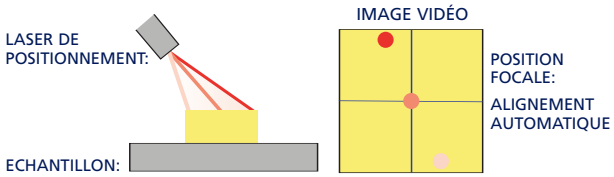


- Alignement précis et rapide de l'échantillon grâce à l'ajustement automatique de la distance ou en utilisant la fonction Auto Laser Focus

FACILE – RAPIDE – PRECIS

Focus laser automatique

Système unique d'alignement automatique



- Démarrage du laser d'un simple clic
- Détermination automatique de la distance focale
  - amélioration du procédé d'alignement
  - amélioration de la reproductibilité
- Fonction Focus Laser standard toujours disponible

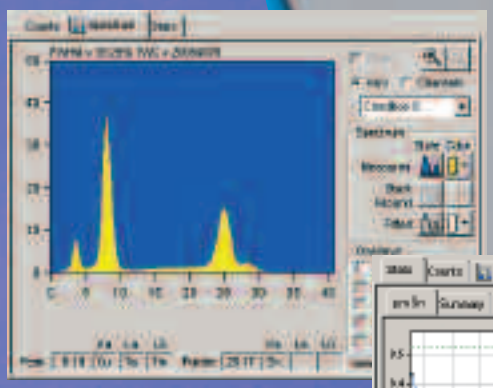
FONCTION INDEPENDANTE DE L'OPERATEUR

Logiciel puissant pour une meilleure qualité de résultats

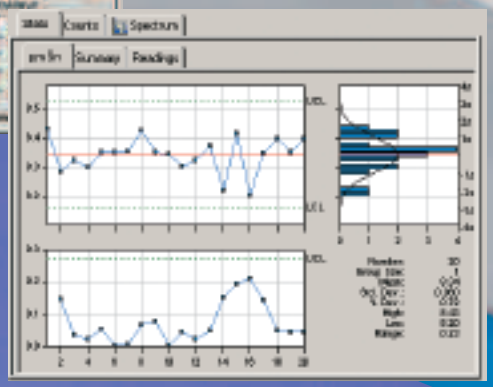
Interface PC intégrée

- Véritable station de travail
  - ergonomie optimisée
  - convivialité
- Simple d'utilisation
  - un seul branchement électrique
  - pas de câblage supplémentaire

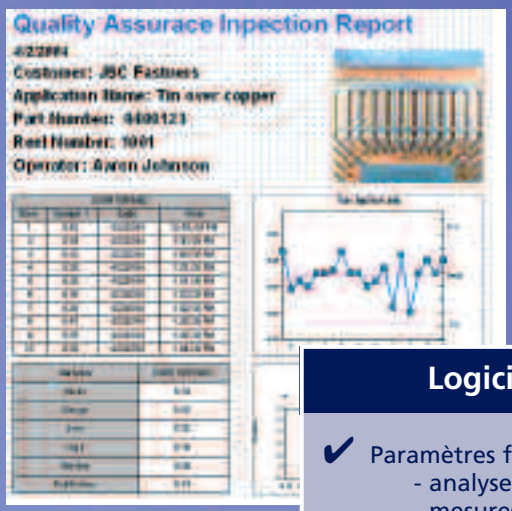
TECHNOLOGIE PLUG & PLAY



Spectre



Statistiques



Rapport

Logiciel **Smart**Link

- ✔ Paramètres fondamentaux
  - analyses quantitatives
  - mesures d'épaisseur
- ✔ Analyse des bains
- ✔ Option de représentation graphique 3D
- ✔ Option de tri des éléments
- ✔ Transfert des données rapide et aisé
- ✔ Génération de rapports et de statistiques
- ✔ Logiciel disponible en 8 langues
- ✔ Programme XYZ de déplacement de la platine intégrant les fonctions de prise de mesure aléatoire, linéaire ou quadrillée ainsi que l'édition des rapports

X-Strata - Conçu pour avancer

Consulter notre site pour plus d'informations: **www.oxford-instruments.com**

cliquez **www.oxford-instruments.com** pour plus d'informations

service et support mondiaux

Oxford Instruments Analytical est leader en technologie des rayons X depuis le début des années 1970, époque où la société a lancé le premier analyseur à fluorescence X par dispersion d'énergie.

A ce jour, avec l'introduction de l'**X-Strata,** Oxford Instruments élargit sa gamme d'analyseurs à fluorescence X pour satisfaire la demande et les besoins de l'industrie, de la recherche, de l'éducation et de la santé publique.

Oxford instruments propose des formations personnalisées sur site pour les techniciens et utilisateurs finaux et s'engage à apporter le support nécessaire au succès de ses clients.

Oxford Instruments, à High Wycombe, applique la réglementation de la gestion qualité conforme à la norme BS EN ISO 9001. Cette publication est le copyright d'Oxford Instruments Analytical Limited et fournit les renseignements (uniquement par accord écrit de la compagnie) s'ils ne sont pas utilisés, appliqués ou reproduits pour quelconque objectif ou à usage de partie de commande ou contrat ou soit considéré comme une représentation concernant les produits ou les services concernés. L'une des politiques d'Oxford Instruments est l'évolution constante. Ainsi, la compagnie se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications, le design ou les conditions de provision de quelque produit ou service. Les marques et inscriptions sont la propriété d'Oxford Instruments.

© Oxford Instruments Analytical Ltd, 2006. All rights reserved.

Part no: OIIA/022/A/1206fr

Certificate No FM29142

Distribué par:

CEGELEC NDT
Brétigny Sur Orge (91)
Tel : 01 69 88 67 06
Fax : 01 69 88 67 94
Email : contact.cndt@cegelec.com

Oxford Instruments Industrial Analysis

UK
Halifax Road, High Wycombe
Bucks, HP12 3SE England
Tel: +44 (0) 1494 442255
Fax: +44 (0) 1494 461033
Email: analytical@oxinst.co.uk

China
Beijing
Tel: (8610) 6518 8160/1/2
Fax: (8610) 6518 8155
Email: info@oichina.cn

Finland
Espoo
Tel: +358 9 329 411
Fax: +358 9 3294 1300
Email: info@oxinst.fi

France
Saclay, Cedex
Tel: +33 (0) 1 69 85 25 24
Fax: +33 (0) 1 69 41 86 80
Email: analytical-info@oxford-instruments.fr

Germany
Wiesbaden
Tel: +49 (0) 6122 937 177
Fax: +49 (0) 6122 937 178
Email: analytical@oxford.de

Japan
Tokyo
Tel: +81 (0) 3 5245 3591
Fax: +81 (0) 3 5245 4466/4477
Email: oikkma@oxinst.co.jp

Latin America
Clearwater FL
Tel: +1 727 538 7702
Fax +1 727 538 4205
Email: oxford@gate.net

Singapore
Tel: +65 6337 6848
Fax: +65 6337 6286
Email: xrf.sales@oxford-instruments.com.sg

USA - Oxford Instruments Measurement Systems
Elk Grove Village IL
Tel: +1 847 439 4404
Fax: +1 847 439 4425
Email: sales@msys.oxinst.com

www.oxford-instruments.com

OXFORD INSTRUMENTS